

Docket No.: GR 99 P 1058

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Wilfried Dähn  
Filed : Concurrently herewith  
Title : Integrated Semiconductor Circuit and Method for Functional  
Testing of Pad Cells



#5  
Priority  
Paper  
5/1/00

CLAIM FOR PRIORITY

Hon. Commissioner of Patents and Trademarks,  
Washington, D.C. 20231

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119,  
based upon the German Patent Application No. 199 01 460.4, filed January 15,  
1999.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being  
submitted herewith.

Respectfully submitted,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Stemer', is written over a horizontal line.

For Applicants

**WERNER H. STEMER**  
**REG. NO. 34,956**

Date: January 18, 2000

Lerner and Greenberg, P.A.  
Post Office Box 2480  
Hollywood, FL 33022-2480  
Tel: (954) 925-1100  
Fax: (954) 925-1101

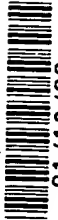
/bb

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

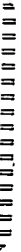


JC688 U.S. PTO

09/484781



01/18/00



## Bescheinigung

Die Siemens Aktiengesellschaft in München/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Integrierte Halbleiterschaltung und Verfahren zur Funktionsüberprüfung von Pad-Zellen"

am 15. Januar 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorläufig die Symbole G 01 R und H 01 L der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 22. November 1999

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Aktenzeichen: 199 01 460.4

Wehner

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## Beschreibung

## Integrierte Halbleiterschaltung und Verfahren zur Funktionsüberprüfung von Pad-Zellen

5

Die Erfindung betrifft eine integrierte Halbleiterschaltung mit Pad-Zellen und ein Verfahren zu deren Funktionsüberprüfung.

- 10 Integrierte Halbleiterschaltungen weisen Pad-Zellen auf, die sich zusammensetzen aus einem Anschlußpad mit einem flächenartigen Anschlußbereich für externe Zuleitungen und einem vorgeschalteten Ausgangstreiber. Die externen Zuleitungen dienen zum Austausch von Daten oder Signalen zwischen unterschiedlichen Schaltungen oder Baugruppen, die in den Pad-
- 15 Zellen integrierten Ausgangstreiber zur Ausgabe von digitalen Signalen auf die externen Zuleitungen. Diese Ausgangstreiber müssen für einen zuverlässigen Betrieb der integrierten Schaltung und der an die Schaltung angeschlossenen Baugruppen in ihrer Funktionsfähigkeit, vor allem hinsichtlich dem Übertragungsverhalten von Signalen, genau spezifizierten Anforderungen genügen.
- 20

- 25 Insbesondere im Anschluß an die Herstellung einer integrierten Schaltung ist es erforderlich, die Funktionsfähigkeit der Schaltung und damit der einzelnen Pad-Zellen zu überprüfen. Hierzu ist es üblich, zur Charakterisierung des Übertragungsverhaltens der Pad-Zellen Messungen vorzunehmen, die Aufschluß über das dynamische Verhalten einer Pad-Zelle bei verschiedenartigen Signalanregungen geben. Solche Signalanregungen sind beispielsweise sprungartige Signalübergänge von einem niedrigen auf einen hohen Signalpegel oder umgekehrt. Das Ausgangssignalverhalten der geprüften Pad-Zelle bei sprungartigen Signalanregungen ist geprägt durch dynamische Verzögerungen von Signalübergängen. Bei einer Funktionsüberprüfung
- 30 wird der zeitliche Signalverlauf am Ausgang der Pad-Zelle gemessen und anschließend untersucht, ob dieses dynamische Ver-
- 35

halten einer Pad-Zelle innerhalb vorgegebener Toleranzen liegt. Die dazu erforderlichen Messungen zu genau definierten Zeiten müssen dabei eine hohe zeitliche Genauigkeit aufweisen, die im momentanen Entwicklungsstand im Bereich weniger  
5 100 ps (Pikosekunden) liegt.

Diese Anforderungen an die Meßgenauigkeit erfordern einen hohen apparativen Aufwand und damit sehr aufwendige und kostspielige Testeinrichtungen. Für anderweitige Funktionstests  
10 von integrierten Schaltungen sind die beschriebenen hohen Anforderungen an die zeitliche Genauigkeit der Testeinrichtungen dagegen meist nicht erforderlich.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine integrierte Halbleiterschaltung mit Pad-Zellen anzugeben, mit der eine Funktionsprüfung der Pad-Zellen hinsichtlich deren Übertragungsverhalten bei einem verhältnismäßig geringen apparativen Meßaufwand vornehmbar ist, und außerdem ein Verfahren  
15 anzugeben zur Durchführung der Funktionsprüfung.

20 Die Aufgabe wird gelöst durch eine integrierte Halbleiterschaltung gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren gemäß Anspruch 8. Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen sind in Unteransprüchen gekennzeichnet.

25 Die erfindungsgemäße integrierte Schaltung weist einen Signalgeber zur Erzeugung periodischer Signalfolgen auf, dessen periodisches Ausgangssignal in einem Testbetrieb einem Eingang einer zu prüfenden Pad-Zelle als Eingangssignal zugeführt ist. Durch die Beaufschlagung der Pad-Zelle mit einem  
30 periodischen Signal kann von extern eine Messung am Ausgang der Pad-Zelle im Frequenzbereich durchgeführt werden.

35 Zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens in Verbindung mit der integrierten Schaltung wird eine Meßanordnung verwendet, mit der eine Messung des Frequenzspektrums durchgeführt wird, durch das das dynamische Verhalten der Pad-Zelle cha-

rakterisiert werden kann. Da für eine hinreichend genaue Analyse erfahrungsgemäß die Erfassung von Oberwellen bis zur fünften Harmonischen ausreicht und der gegenseitige Frequenzabstand zwischen diesen Harmonischen relativ groß ist, können  
5 die Anforderungen an die Auflösung der Messung im Frequenzbereich und damit der apparative Aufwand der Meßeinrichtung gering gehalten werden.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Schaltung sieht vor, daß  
10 der Signalgeber umprogrammierbar ist zur Erzeugung verschiedener periodischer Signalfolgen. So besteht die Möglichkeit, die Messung an die Charakteristik unterschiedlich schnell schaltender Pad-Zellen anzupassen, beispielsweise durch eine Signalfolge mit geringer Periodendauer bei verhältnismäßig  
15 schnell schaltenden Ausgangstreibern und eine Signalfolge mit längerer Periodendauer bei verhältnismäßig langsam schaltenden Ausgangstreibern.

Bei mehreren zu prüfenden Pad-Zellen können die Eingänge der  
20 zu prüfenden Pad-Zellen parallel mit einem oder mehreren Anschlüssen für das Ausgangssignal des Signalgebers verbunden sein, oder seriell über beispielsweise je eine Schieberregisterzelle mit einem Anschluß für das Ausgangssignal des Signalgebers verbunden sein. So erhalten alle zu prüfenden Pad-  
25 Zellen zeitversetzt um je eine Taktperiode das gleiche Eingangssignal.

Um möglichst einfach zwischen Normalbetrieb und Testbetrieb umschalten zu können, ist es von Vorteil, je eine Multiple-  
30 xerschaltung zwischen den Eingang der Pad-Zelle und den Ausgang des Signalgebers zu schalten, die beispielsweise von einer Betriebsartensteuerung gesteuert wird.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der in der Zeichnung  
35 dargestellten Figuren näher erläutert. Es zeigen:

- Figur 1                   im oberen Teil eine Anordnung zur Messung des dynamischen Verhaltens einer Pad-Zelle, im unteren Teil den beispielhaften Verlauf einer Sprungantwort am Ausgang der Pad-Zelle,
- Figur 2                   eine Darstellung eines Ausgangstreibers einer Pad-Zelle mit Modellparametern,
- Figuren 3 und 4       Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemäßen integrierten Schaltung mit mehreren zu prüfenden Pad-Zellen.

Figur 1 zeigt im oberen Teil eine Anordnung zur Funktionsprüfung einer Pad-Zelle PC einer integrierten Schaltung. Mit dieser Anordnung soll das Übertragungsverhalten des Ausgangstreibers der Pad-Zelle PC in einem Testbetrieb charakterisiert werden. Dazu wird am Eingang E der Pad-Zelle PC (Anschluß für das Eingangssignal des Ausgangstreibers) ein digitales Signal  $U_E$  gleich einer Sprungfunktion von einem niedrigen Signalpegel auf einen hohen Signalpegel angelegt und der Signalverlauf des Signals  $U_{DQ}$  am Ausgang DQ der Pad-Zelle PC (Anschluß für die an das Anschlußpad anzuschließende Zuleitung) gemessen. Dieser Signalverlauf charakterisiert das dynamische Verhalten der Pad-Zelle PC, die anhand eines Ersatzschaltbildes mit Modellparametern nachgebildet werden kann. Ein beispielhaftes Schaltbild eines Ausgangstreibers einer Pad-Zelle PC mit den Modellparametern  $R_{D1}$ ,  $R_{D2}$ ,  $L$ ,  $C$  ist in Figur 2 dargestellt.

Im unteren Teil der Figur 1 ist ein vereinfachter Verlauf der sogenannten Sprungantwort des Signals  $U_{DQ}$ , hervorgerufen durch die Sprungfunktion des Signals  $U_E$ , dargestellt. Der Spannungspegel des Signals  $U_{DQ}$  steigt dabei ab dem Einschaltzeitpunkt  $t_1$  nicht sprunghaft auf den Wert  $U_H$  im stationären Zustand an, sondern in einem dynamischen Verlauf gemäß den Werten der Modellparameter  $R_{D1}$ ,  $R_{D2}$ ,  $L$ ,  $C$  entsprechend langsa-



mer, charakterisiert durch die Zeitkonstante  $\tau$ . Deren Größe ist, wie allgemein bekannt, von den Werten der Modellparameter  $R_{D1}$ ,  $R_{D2}$ ,  $L$ ,  $C$  abhängig.

- 5 Das Kriterium der Funktionstüchtigkeit einer Pad-Zelle PC in Figur 1 ist, daß der Spannungspegel des Signals  $U_{DQ}$  zwischen einer Mindestzeit  $t_{min}$  und einer Maximalzeit  $t_{max}$  ab dem Einschaltzeitpunkt  $t_1$  einen Wert aufweist, der in dem Toleranzbereich zwischen einem Mindestwert  $U_{min}$  und einem Maximalwert  $U_{max}$  liegt. Der Verlauf 1 des Signals  $U_{DQ}$  zeigt eine beispielhafte Sprungantwort einer funktionstüchtigen Pad-Zelle PC. Der Verlauf 2 des Signals  $U_{DQ}$  zeigt eine beispielhafte Sprungantwort einer fehlerhaften Pad-Zelle PC. Die Zeitdauer zwischen  $t_{min}$  und  $t_{max}$  beträgt im momentanen Entwicklungsstand
- 10 wenige 100 ps, das bedeutet, es werden vergleichsweise hohe Anforderungen an die Meßgenauigkeit der Meßapparatur gestellt. Diese haben die eingangs bereits erwähnten Konsequenzen insbesondere hinsichtlich hoher Anschaffungskosten.
- 15
- 20 Figur 3 zeigt eine Schaltungsanordnung mit einem Signalgeber SG zur Erzeugung periodischer Signalfolgen. Werden die Pad-Zellen PC an deren Eingänge E mit einer periodischen Signalfolge stimuliert, ist an deren Ausgängen DQ ebenfalls ein periodischer Verlauf der Ausgangssignale  $U_{DQ}$  zu beobachten, der sich je nach Beschaffenheit des Eingangssignals zusammensetzt aus einem Gleichanteil, einer Grundwelle und Oberwellen. Dieser Verlauf kann in einem Meßverfahren mit einer an dem Ausgang DQ von extern angeschlossenen Meßanordnung SAZ, die zur Durchführung einer Spektralanalyse geeignet ist, beispielsweise mit einem sogenannten Spektralanalysator, gemessen werden und durch eine Analyse des aufgenommenen Frequenzspektrums charakterisiert werden.
- 25
- 30

Je nach erforderlicher Genauigkeit der Überprüfung des Übertragungsverhaltens wird ein mehr oder weniger detailliertes Ersatzschaltbild der zu prüfenden Pad-Zelle PC erstellt mit

35 je nach Detaillierungsgrad mehr oder weniger verschiedenarti-

gen Modellparametern. In dem Beispiel nach Figur 2 wurde die Pad-Zelle PC durch die Modellparameter  $R_{D1}$ ,  $R_{D2}$ ,  $L$  und  $C$  charakterisiert. Die Widerstände  $R_{D1}$  und  $R_{D2}$  modellieren dabei die Durchlaßwiderstände der Schalttransistoren  $T1$  und  $T2$ ,  $L$  die Zuleitungsinduktivitäten und  $C$  die Leitungskapazitäten. Bei einer an die Messung anschließenden Auswertung werden anhand des Frequenzspektrums, das den Amplitudengang und/oder den Phasengang umfaßt, in bekannter Weise (beispielsweise mittels einer Fourieranalyse) nacheinander die Werte der vorher aufgestellten Modellparameter der Pad-Zelle PC bestimmt und daraus die Sprungantwort der Pad-Zelle PC berechnet, die Aufschluß darüber gibt, ob das Kriterium für die Funktionsfähigkeit eingehalten ist. Es ist in dem Zusammenhang auch möglich, die Sprungantwort mit den bekannten Analyseverfahren direkt anhand des Frequenzspektrums zu eruieren, ohne vorher ein Ersatzschaltbild mit Modellparametern aufzustellen.

Die Anzahl der zu ermittelnden Harmonischen des Frequenzspektrums richtet sich im wesentlichen nach der Anzahl der aufgestellten Modellparameter. Je mehr Modellparameter bestimmt werden müssen, desto höher die Anzahl der zu erfassenden Oberwellen. Diese werden beginnend mit der Grundwelle in aufsteigender Reihenfolge erfaßt, und es wird der Amplitudengang und/oder Phasengang aufgezeichnet. Erfahrungsgemäß reicht die Ermittlung bis zur fünften Harmonischen für eine ausreichende Genauigkeit aus. Da nur diese Oberwellen erfaßt werden, deren gegenseitiger Frequenzabstand im Vergleich zu den Oberwellen ab der fünften Harmonischen relativ groß ist, bleibt der Aufwand der Meßapparatur hinsichtlich der Frequenzselektivität relativ gering und ist damit deutlich kleiner als bei einer beschriebenen Messung im Zeitbereich. Die Sprungantwort berechnet sich durch die Zeitkonstante  $\tau$ , die mit den Werten der Modellparameter berechnet wird.

Bei verhältnismäßig langsam schaltenden Pad-Zellen PC können die Leitungsinduktivität  $L$  sowie die Lastkapazität  $CL$  und Leitungskapazität  $C$  gegenüber den Durchlaßwiderständen  $R_{D1}$ ,

- Rd2 der Transistoren T1 und T2 vernachlässigt werden. Dadurch kann die Messung im Frequenzbereich ersetzt werden durch eine einfache Gleichstrommessung am Ausgang DQ. Aus den Werten der Versorgungsspannung VCC bzw. VSS und den Strömen I1 und I2 lassen sich die Widerstände Rd1 bzw. Rd2 berechnen und damit, wie oben erwähnt, die Sprungantwort des Signals U<sub>DQ</sub>. Zur Durchführung dieser Messung ist es jedoch erforderlich, die Periodendauer des stimulierenden Eingangssignals U<sub>E</sub> zu vergrößern, so daß je Messung der Ströme I1 und I2 ein quasi-stationärer Zustand am Ausgang DQ entsteht. Die Umstellung der Periodendauer des Signals U<sub>E</sub> kann beispielsweise durch Umprogrammierung des Signalgebers SG durch ein externes Steuersignal BS einer Betriebsartensteuerung geschehen.
- 15 Aus Figur 3 ist anhand eines Ausführungsbeispieles der erfindungsgemäßen Schaltung erkennbar, daß die Eingänge E mehrerer zu prüfender Pad-Zellen PC parallel mit einem Anschluß A für das periodische Ausgangssignal des Signalgebers SG verbunden sind. Es ist auch eine Variante denkbar, daß bei mehreren  
20 vorhandenen Ausgängen A des Signalgebers SG jeder einzelne parallel mit je einem der Eingänge E der Pad-Zelle PC verbunden ist.
- Um zwischen dem Testbetrieb zur Funktionsprüfung der Pad-Zellen PC als einer ersten Betriebsart der integrierten Schaltung und einem Normalbetrieb als einer zweiten Betriebsart der integrierten Schaltung umzuschalten, ist zwischen dem Ausgang des Signalgebers SG und je einem Anschluß E für das Eingangssignal der Pad-Zellen PC eine Multiplexerschaltung  
25 MUX vorgesehen, die beispielsweise auch von dem Signal BS einer Betriebsartensteuerung gesteuert wird. Ein weiterer Eingang der Multiplexerschaltung MUX neben dem ersten Eingang, an dem das Ausgangssignal des Signalgebers SG anliegt, ist jeweils für ein im Normalbetrieb auszugebendes Signal 0 bis n  
30 einer anderen Funktionseinheit der integrierten Schaltung vorgesehen.

Figur 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Schaltung. Hier sind die Anschlüsse E für die Eingangssignale mehrerer zu prüfender Pad-Zellen PC seriell über jeweils eine taktgesteuerte Schieberegisterzelle FF0 bis FF<sub>n</sub> mit einem Anschluß A für das Ausgangssignal des Signalgebers SG verbunden. Dadurch liegt an jeder Pad-Zelle PC zeitversetzt um je eine Taktperiode der Schieberegisterzellen FF0 bis FF<sub>n</sub> das periodische Ausgangssignal des Signalgebers SG an. Dieses Ausführungsbeispiel ist vorteilhaft bei Schaltungen, bei denen die Pad-Zellen PC zu anderweitigen Zwecken bereits über Schieberegisterzellen FF0 bis FF<sub>n</sub> miteinander verbunden sind (z. B. bei Leiterplatten mit "Boundary scan").

Die Schieberegisterzellen FF0 bis FF<sub>n</sub> und der Signalgeber SG lassen sich beispielsweise mit taktgesteuerten bistabilen Kippstufen realisieren. Beim Signalgeber SG kann es sich beispielsweise um ein T-Flipflop mit festbeschaltetem Eingang handeln, die Schieberegisterzellen FF0 bis FF<sub>n</sub> lassen sich beispielsweise mit D-Flipflops realisieren. Der Signalgeber SG und die Schieberegisterzellen FF0 bis FF<sub>n</sub> werden sinnvollerweise vom gleichen Takt gesteuert. Die T-Flipflops sind, wie oben beschrieben, vorteilhafterweise so ausgeführt, daß die jeweiligen periodischen Ausgangssignale durch Umprogrammierung verändert werden können.

## Patentansprüche

1. Integrierte Halbleiterschaltung mit einer oder mehreren Pad-Zellen (PC), die jeweils ein Anschlußpad und einen vorge-  
5 schalteten Ausgangstreiber umfassen und die in einer ersten Betriebsart der Schaltung anhand einer Funktionsprüfung kontrollierbar sind,  
dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltung einen Signalgeber (SG) zur Erzeugung periodischer Signalfolgen auf-  
10 weist, bei dem ein Anschluß (A) für ein periodisches Ausgangssignal mit einem Anschluß (E) für ein Eingangssignal einer zu prüfenden Pad-Zelle (PC) verbunden ist zur Überprüfung des Übertragungsverhaltens der Pad-Zelle (PC) in der ersten Betriebsart.
- 15 2. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, daß der Signalgeber (SG) umprogrammierbar ist zur Erzeugung verschiedener periodischer Signalfolgen.
- 20 3. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlüsse (E) für die Eingangssignale mehrerer zu prüfender Pad-Zellen (PC)  
25 parallel mit einem oder mehreren Anschlüssen (A) für das Ausgangssignal des Signalgebers (SG) verbunden sind.
- 30 4. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlüsse (E) für die Eingangssignale mehrerer zu prüfender Pad-Zellen (PC) seriell über jeweils eine Schieberegisterzelle (FF0; FF<sub>n</sub>) mit einem Anschluß (A) für das Ausgangssignal des Signalgebers (SG) verbunden sind.
- 35 5. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlüsse (E) für die Eingangssignale der zu prüfenden Pad-Zellen (PC) über jeweils eine Multiplexerschaltung (MUX) mit einem Anschluß (A) für das Ausgangssignal des Signalgebers (SG) verbunden sind  
5 zum Umschalten zwischen der ersten Betriebsart und einer zweiten Betriebsart der Schaltung.

6. Integrierte Halbleiterschaltung nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
- 10 - ein Ausgang der Multiplexerschaltung (MUX) ist mit dem Anschluß (E) für das Eingangssignal einer zu prüfenden Pad-Zelle (PC) verbunden,
  - ein Eingang der Multiplexerschaltung (MUX) ist mit einem Anschluß (A) für das Ausgangssignal des Signalgebers (SG)  
15 verbunden,
  - ein weiterer Eingang der Multiplexerschaltung (MUX) ist mit einem Anschluß für ein Signal (0; n) einer anderen Funktionseinheit der integrierten Schaltung verbunden,
  - am Ausgang der Multiplexerschaltung (MUX) liegt in der er-  
20 sten Betriebsart der Schaltung das Ausgangssignal des Signalgebers (SG) an, in der zweiten Betriebsart das Signal (0; n) der anderen Funktionseinheit der integrierten Schaltung.

- 25 7. Integrierte Halbleiterschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, daß der Signalgeber (SG) eine taktgesteuerte bistabile Kippstufe vom Typ T-Flipflop enthält.

30

8. Verfahren zur Überprüfung des Übertragungsverhaltens von Pad-Zellen (PC) einer integrierten Halbleiterschaltung, die jeweils ein Anschlußpad und einen vorgeschalteten Ausgangstreiber umfassen und die in einer integrierten Halbleiterschaltung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 enthalten sind,  
35 dadurch gekennzeichnet, daß ein Ausgang (DQ) einer zu prüfenden Pad-Zelle (PC) mit einem Meßeingang einer zur

Spektralanalyse geeigneten Meßanordnung (SAZ) verbunden wird und das Übertragungsverhalten der Pad-Zelle (PC) mit der Meßanordnung (SAZ) im Frequenzbereich gemessen wird.

- 5 9. Verfahren nach Anspruch 8,  
dadurch gekennzeichnet, daß der Amplitudengang  
und/oder der Phasengang des aufgezeichneten Frequenzspektrums  
gemessen wird.
- 10 10. Verfahren nach Anspruch 8,  
dadurch gekennzeichnet, daß anstelle der Messung  
im Frequenzbereich das Übertragungsverhalten der Pad-Zelle  
(PC) durch eine Gleichstrommessung am Ausgang (DQ) der Pad-  
Zelle (PC) gemessen wird.

## Zusammenfassung

Integrierte Halbleiterschaltung und Verfahren zur Funktions-  
überprüfung von Pad-Zellen

5

Eine integrierte Halbleiterschaltung mit Pad-Zellen (PC), die jeweils ein Anschlußpad und einen Ausgangstreiber umfassen und die in einem Testbetrieb in ihrem Übertragungsverhalten zu überprüfen sind, weist einen Signalgeber (SG) zur Erzeugung periodischer Signalfolgen auf. Ein periodisches Ausgangssignal des Signalgebers (SG) ist einem Eingang (E) einer zu prüfenden Pad-Zelle (PC) als Eingangssignal zugeführt. Anhand eines entsprechenden periodischen Signals am Ausgang (DQ) der Pad-Zelle (PC) wird die Überprüfung des Übertragungsverhaltens der Pad-Zelle (PC) durch ein Meßverfahren mit einem Spektralanalysator (SAZ) im Frequenzbereich vorgenommen. Dadurch werden die bisher praktizierten aufwendigen Messungen im Zeitbereich vermieden.

20

Figur 3



FIG 1

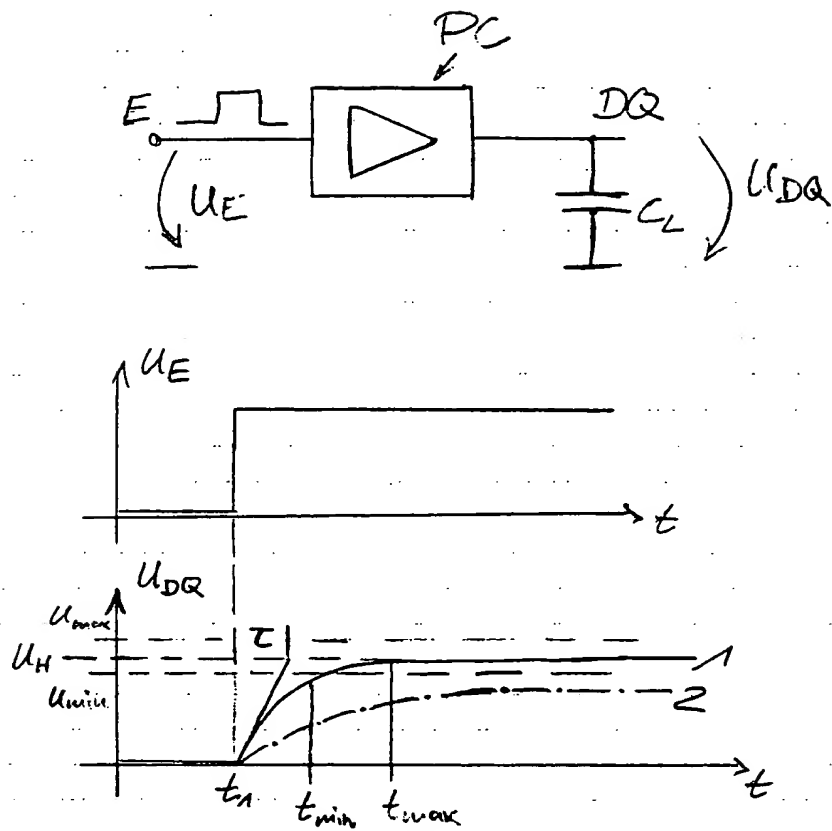
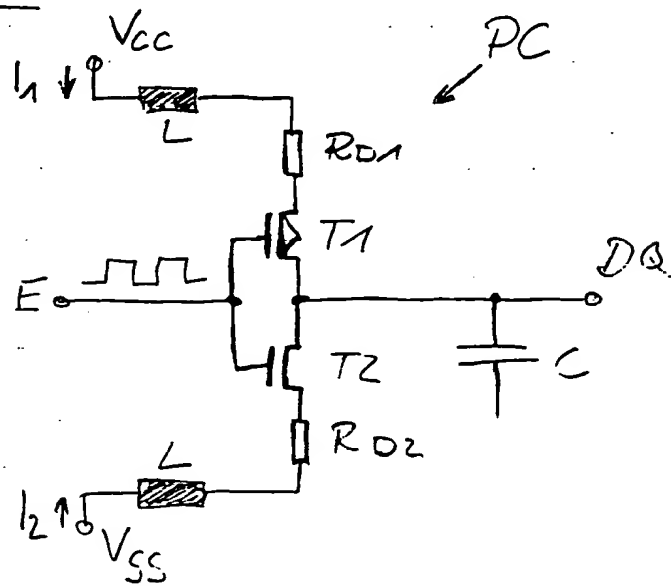
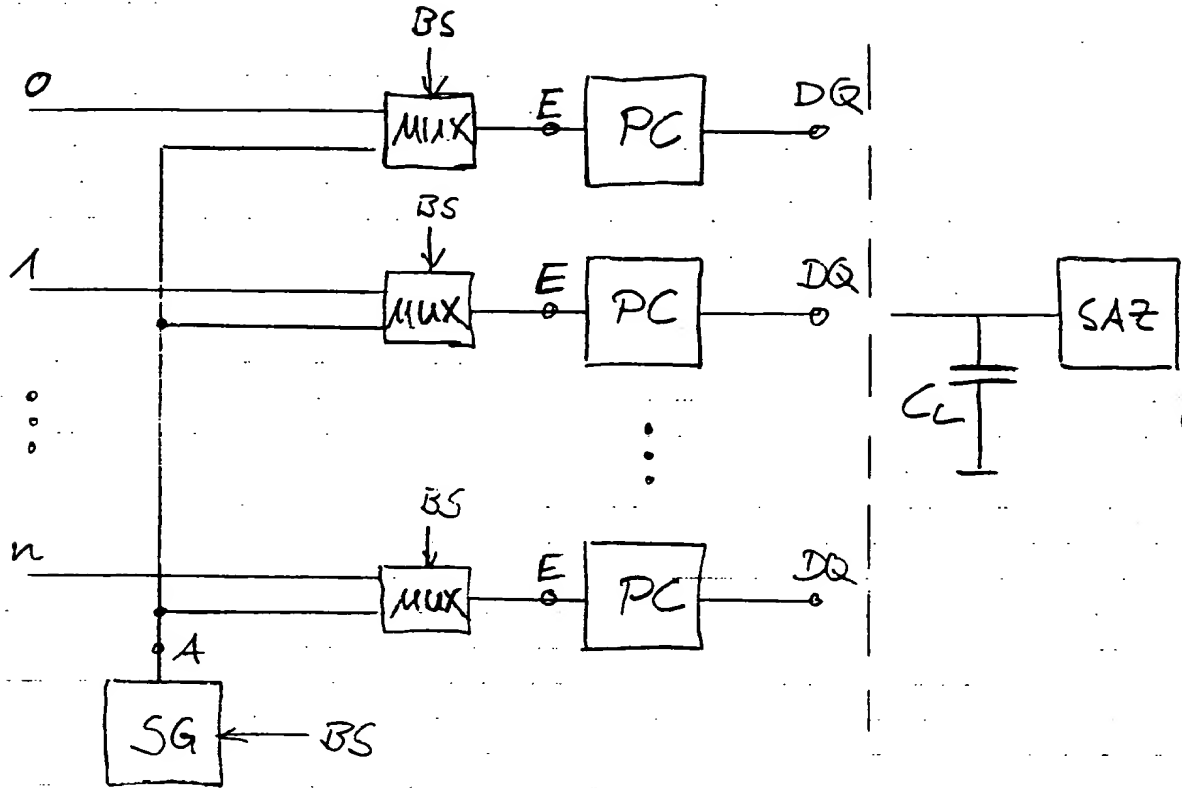


FIG 2



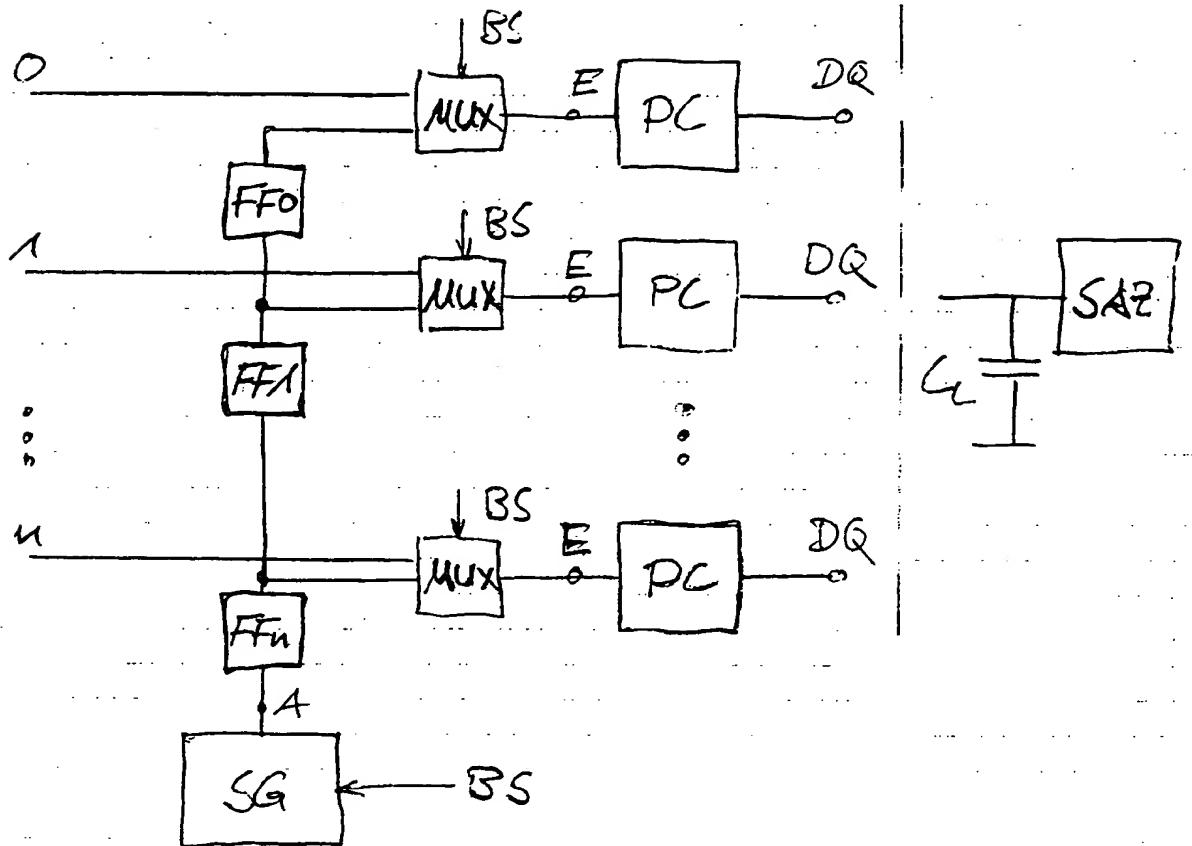
2/3

FIG 3



3/3

FIG 4



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**